

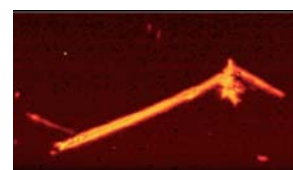
# 共焦拉曼光谱仪与原子力显微镜联用技术

## Fully integrated Renishaw Raman-AFM/SNOM solution

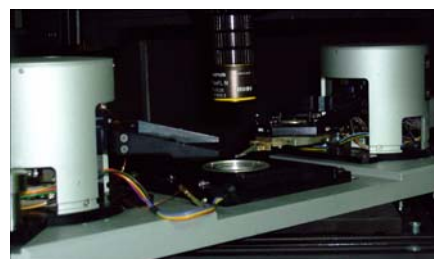
- 进行AFM 微区形貌扫描成像的同时，控制Renishaw激光拉曼光谱仪进行同步拉曼扫描成像，形貌和结构图像可叠加显示。
- 实现高空间分辨率形貌成像的AFM：高性能、低噪音的NANONICS 或 NT-MDT等厂家的原子力/近场光学系统
- 用于化学结构分析的显微拉曼：高度灵活的Renishaw inVia显微共焦拉曼光谱仪
- 全面支持TERS测试（针尖增强拉曼散射）
- 高效直接耦合光路（无需光纤）充分保障通光效率，极大缩短了拉曼测量时间
- inVia系统可配备多种激发波长，适用于种类广泛的材料分析
- 正置和倒置显微镜均可配置
- 一台计算机同时控制拉曼和原子力两套系统



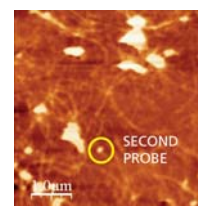
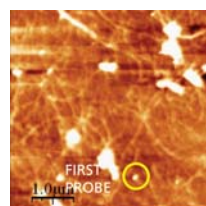
纳米线的AFM形貌成像



相应的纳米线拉曼成像



Nanonics MultiView 4000的双扫描探针台



两个独立探针分别同时获得的碳纳米管图像